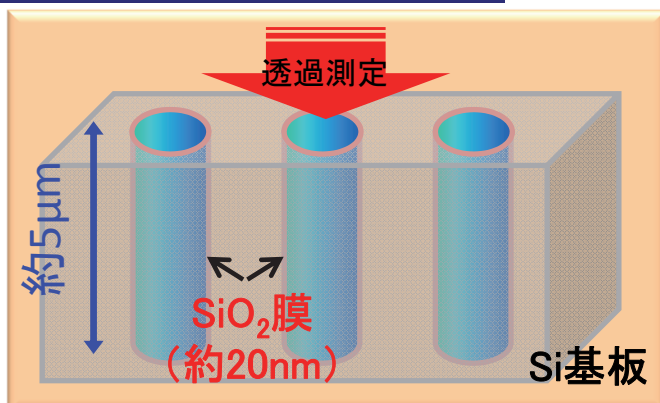


カバレッジ酸化膜の深さ方向膜質評価

アスペクト比の高いビアでは、カバレッジSiO₂膜は深さ方向に膜質が変化する可能性がある。本ポスターでは、FT-IRを用いてビアのカバレッジSiO₂膜の深さ方向分析を行った事例を紹介する。

カバレッジSiO₂膜の膜質評価

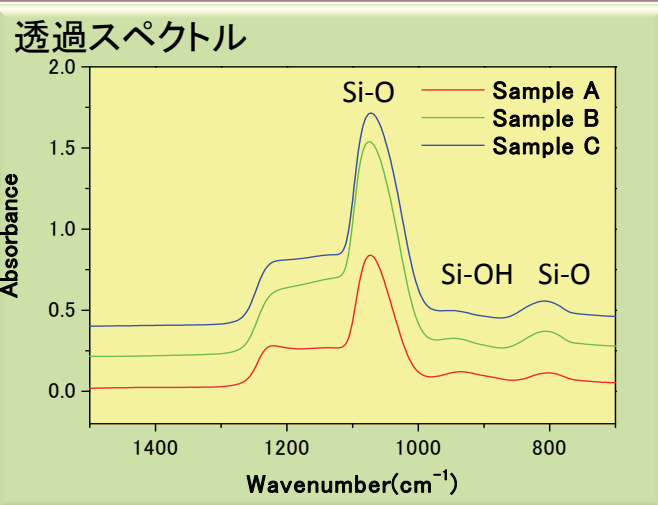
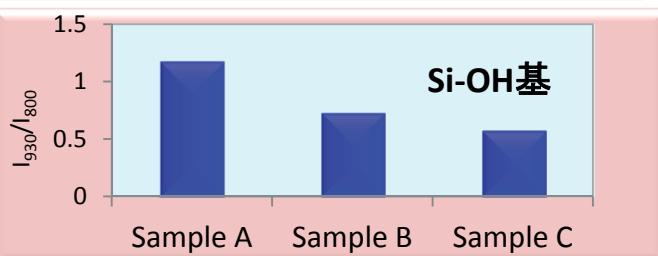


◆透過測定で、カバレッジSiO₂膜の膜質について議論できる。

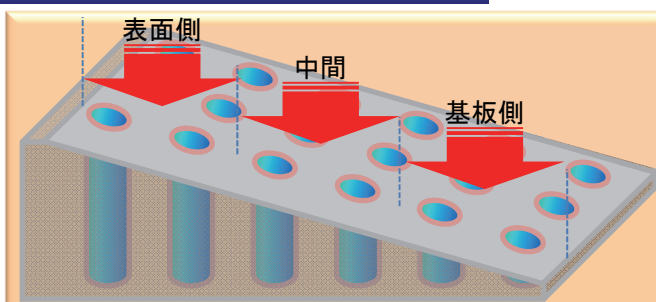
Si-OH基量:

Sample A > Sample B > Sample C

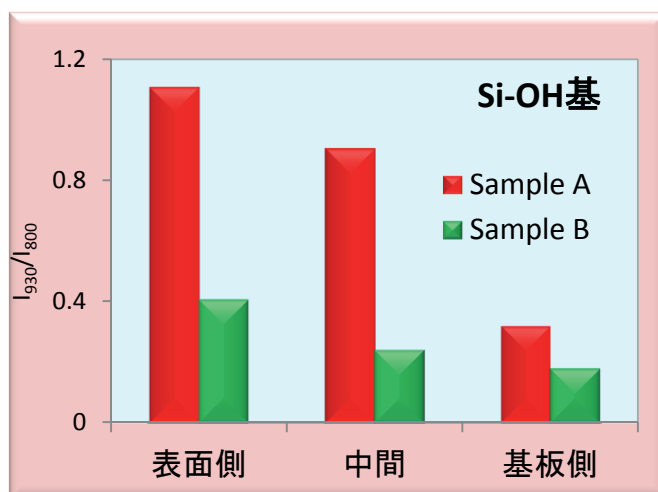
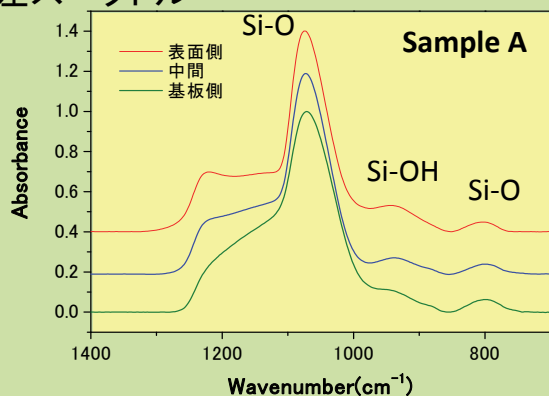
◆Si-Oの吸収強度から、Sample Aの膜厚が薄いことが示唆される。



カバレッジSiO₂膜の深さ方向分析



差スペクトル



◆傾斜面を測定することで、カバレッジSiO₂膜深さ方向の膜質評価が可能である。

Si-OH基量:

表面側 > 中間 > 基板側